Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-179153

(43) Date of publication of application: 20.07.1993

(51)Int.CI.

C09B 47/06 C09B 47/067

(71)Applicant: NIPPON PETROCHEM CO LTD

(22)Date of filing:

27.12.1991

(72)Inventor: SHIMIZU ISOO

(54) PREPARATION OF PIGMENT

(21)Application number: 03-361348

(57)Abstract: 4

PURPOSE: To prepare advantageously a copper

phthalocyanine pigment.

CONSTITUTION: A method for preparing a copper

phthalocyanine by thermally reacting phthalic anhydride or its derivative, urea, and copper or its salt, or phthalonitrile or its derivative and copper or its derivative in a solvent, wherein the reaction is effected in the presence of a medium that contains the component of the formula and is liquid at ordinary temperature.

C. .. - C (CH.) . CH (CH.) - CII.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

 [Patent number]
 3084494

 [Date of registration]
 07.07.2000

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-197153

(43)公開日 平成5年(1993)8月6日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 3 F 7/039 C 0 8 L 77/10	501 LQX	9286-4 J		
G03F 7/022	LQX	9200—4 J		
7/30		7124-2H		
		7352-4M	H01L	21/30 3 0 1 R
			審査請求 未請求	ま 請求項の数10(全 7 頁) 最終頁に続く
(21)出顯番号	特顧平4-139694		(71)出願人	390039413
				シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト
(22)出顧日	平成4年(1992)5月	1日		SIEMENS AKTIENGESEL
				LSCHAFT
(31)優先権主張番号	P4114928.	9		ドイツ連邦共和国 ベルリン 及び ミユ
(32)優先日	1991年5月7日			ンヘン (番地なし)
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)		(72)発明者	アルベルト ハンマーシユミツト
				ドイツ連邦共和国 8520 エルランゲン
				コプルガー シユトラーセ 47 アー
			(74)代理人	弁理士 富村 潔
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 耐高熱性ポジ型レジスト及び耐高熱性レリーフ構造物の製法

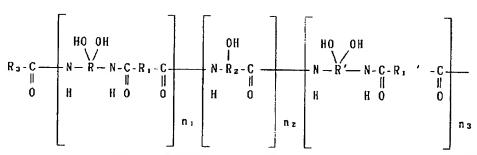
(57)【要約】

*【構成】

【目的】 貯蔵安定性に関する難点を生じない価格的に 有利な耐高熱性ポジ型レジストを提供する。

【化1】

式:



[式中R、R′、R₁、R₁′及びR₂ は芳香族基であ り、R』はアルケニル基又はアルキニル基を少なくとも 1個有する脂肪族、脂環式又は芳香族基であり、 n1 、 n2 及びn3 に関しては以下の通りである。n1 = 1~ 100、 n_2 及び $n_3 = 0$ 又は n_1 及び $n_2 = 1 \sim 10$ 0、 $n_3 = 0$ 又は $n_2 = 1 \sim 100$ 、 n_1 及び $n_3 = 0$

又はn₁、n₂及びn₃=1~100(但しR≠R′及 0、 $n_2 = 0$ (但し $R \neq R'$ 及び/又は $R_1 \neq R_1'$) (但しn: +n2 +n3 ≥3)] のヒドロキシポリアミ ドである。

ポリベンズオキサゾール前駆体が以下の構造

(2)

特開平5-197153

【特許請求の範囲】

【請求項1】 オリゴマー及び/又はポリマーのポリベ ンズオキサゾール前駆体及びジアゾキノンをペースとす*

> HO OH ОН -R -- N - C - R ₁ - C-N-Ŕ2-C H O Н Õ n ı

[式中R、R′、R₁ 、R₁ ′ 及びR₂ は芳香族基であ り、R』はアルケニル基又はアルキニル基を少なくとも 1個有する脂肪族、脂環式又は芳香族基であり、n1 、 n_2 及び n_3 に関しては以下の通りである。 $n_1 = 1$ ~ 100、n2 及びn3 = 0又はn1 及びn2 = 1~10 $0, n_3 = 0$ 又は $n_2 = 1 \sim 100, n_1$ 及び $n_3 = 0$ 又は n_1 、 n_2 及び $n_3 = 1 \sim 100$ (但し $R \neq R'$ 及 20 法に関する。 $0, n_2 = 0$ (但しR \neq R′及び/又はR₁ \neq R₁ ′) (但しn: +n2 +n3 ≥3)] のヒドロキシポリアミ ドであることを特徴とする耐高熱性ポジ型レジスト。

【請求項2】 ジアゾキノンが6-ジアゾ-5(6)-オキソー1ーナフタリンスルホン酸のエステル又はアミ ドである請求項1記載のポジ型レジスト。

【請求項3】 ヒドロキシポリアミドとジアゾキノンの 質量比が1:20~20:1、特に1:10~10:1 である請求項1又は2記載のポジ型レジスト。

【請求項4】 請求項1ないし3の1つに記載のポジ型 レジストを層又は箔の形で基板に施し、マスクを介して 化学光線で露光するか又は光線、電子線又はイオン線を 導くことによって照射し、露光又は照射された層又は箔 部分を溶出又は除去し、その際得られたレリーフ構造物 を焼結する耐高熱性レリーフ構造物の製法。

ポジ型レジストを有機溶剤中に溶解し基 【請求項5】 板に施す請求項4記載の方法。

【請求項6】 溶剤としてN-メチルピロリドンを使用 する請求項5記載の方法。

【請求項7】 溶液を遠心分離法で基板に施す請求項6 記載の方法。

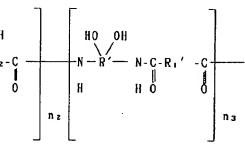
ガラス、プラスチック、半導体物質又は 【請求項8】 金属からなる基板を使用する請求項4ないし7の1つに 記載の方法。

【請求項9】 接着剤及び/又は湿潤剤を使用する請求 項4ないし8の1つに記載の方法。

【請求項10】 200~500℃、特に300~40 0℃の温度で焼結する請求項4ないし9の1つに記載の 方法。

*る耐高熱性ポジ型レジストにおいて、ポリペンズオキサ ゾール前駆体が以下の構造式:

【化1】



【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はオリゴマー及び/又はポ リマーのポリベンズオキサゾール前駆体及びジアゾキノ ンをベースとする耐高熱性ポジ型レジスト並びにこの種 のポジ型レジストからなる耐高熱性レリーフ構造物の製

[0002]

【従来の技術】有機絶縁層の価格的に有利な直接構造化 に必要とされる耐高熱性ホトレジストでは、ヒドロキシ ポリアミドが可溶性ポリベンズオキサゾール前駆体とし て用いられている。ヒドロキシポリアミドから得られる ポリベンズオキサゾールは高温安定性及び僅かな吸水性 によってまた傑出した電気特性において優れている。ポ リベンズオキサゾールは特にアルカリ性エッチング処理 時におけるエッチングマスクとして及び半導体製造にお 30 ける有機誘電体としても用いられている。

【0003】光構造化可能のポリベンズオキサゾール前 駆体はポジ型レジストでもネガ型レジストでも使用する ことができる。ポジ型レジストはポリマー前駆体の他に 光活性成分をジアゾキノンの形で含有しており(これに 関しては欧州特許第0023662号、欧州特許出願公 開第0291779号及びドイツ連邦共和国特許出願公 開第3716629号明細書参照のこと)、一方ネガ型 レジストは網状化可能の不飽和基を有するポリマー前駆 体を有している(これに関しては欧州特許第00416 77号明細書参照のこと)。

【0004】しかし前記の両レジスト型の場合貯蔵安定 性に関して難点がある。ヒドロキシポリアミドを含んで いるポジ型レジストの場合には濃縮されたレジスト溶液 中で重縮合が生じる可能性があり、一方ネガ型レジスト はアクリル基及びメタクリル基のような不飽和基が存在 するために重合する傾向がある。両レジスト型において このことは粘性を高め、その結果ゲル化に至る。更にポ ジ型レジストでは光活性成分が塩基性アミノ末端基によ って又はアミンモノマー及びアミドオリゴマーによって 破壊されるおそれがある。

50

(3)

特開平5-197153

3

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、従来のオリゴマー及び/又はポリマーのポリベンゾオキサゾール前駆体及びジアゾキノンをベースとする耐高熱性ポジ型レジストが有する、貯蔵安定性に関する難点を生じないこの種の価格的に有利な耐高熱性ポジ型レジストを提供することにある。その際レジスト溶液は十分に貯蔵*

*安定性のみならず、400℃以上で形状安定性を有する レリーフ構造物を形成できるものでなければならない。 【0006】

【課題を解決するための手段】この課題は本発明によればポリベンズオキサゾール前駆体が以下の構造式:◎ 【化2】

[式中R、R´、R₁ 、R₁ ′ 及びR₂ は芳香族基であり、R₃ はアルケニル基又はアルキニル基を少なくとも1個有する脂肪族、脂環式又は芳香族基であり、n₁ 、n₂ 及びn₃ に関しては以下の通りである。n₁ = 1 ~ 100、n₂ 及びn₃ = 0又はn₁ 及びn₂ = $1 \sim 10$ 0、n₃ = 0又はn₂ $= 1 \sim 10$ 0、n₃ = 0又はn₂ = $1 \sim 10$ 0、n₄ 及びn₅ = 0又はn₁、n₂ 及びn₃ = $1 \sim 10$ 0(但しR \neq R′及び/又はR₁ \neq R₁ ′)又はn₁ 及びn₃ = $1 \sim 10$ 0、n₂ = 0 (但しR \neq R′及び/又はR₁ \neq R₁ ′)(但しn₁ + n₂ + n₃ \geq 3)]のヒドロキシポリアミドであることによって解決される。

[0007]

【作用効果】本発明によるポジ型レジストに使用される 30 る。ポリベンズオキサゾール前駆体は特殊な構造を有するヒ ドロキシポリアミドである。すなわちこれらのヒドロキ

シポリアミドの場合他の通常存在するアミノ末端基が全く特殊な方法で改質されている。すなわちアミノ末端基20のこの改質は、レジスト溶液の粘性及び安定性に関して、光活性成分としてジアゾキノンを有する貯蔵安定なポジ型レジストを生じるポリベンズオキサゾール前駆体をもたらす。この種の貯蔵安定なポジ型レジストからは、ホトリソグラフィー法で驚くべきことに400℃以上の温度で焼結した際形状安定であるレリーフ構造物を形成することができる。

【0008】上記形式のヒドロキシポリアミドとしては 一般に以下のものが相当する。

【0009】 R及びR' は以下のものを表すことができる。

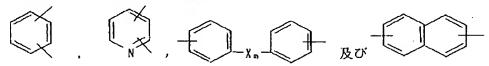
【化3】

(4)

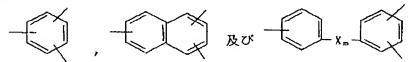
特開平5-197153

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ &$$

【0010】R: 及びR: は以下のものを表すことがで * ていてもよい。 きるが、その際H原子がCI又はBrによって置換され*30 【化4】



【0011】R2は以下のものを表すことができる。 ※ ※ 【化5】



その際芳香族基はアルキル置換基を有していてよい。 【0012】その際m及びxとしては次のものが相当す る。m=0又は1、及びxは以下のものを表す。 【化6】 (5) 特開平5-197153

その際 $z = 1 \sim 10$ 個の炭素原子を有するアルキル又は * $\{0013\}$ R₃ は以下のものを表すことができる。 アリール、及び $r = 2 \sim 18$ に相当する。 【化7】

又は
$$M_x - (CH_2)_y - M_x - Q - (CH_2)_y - H$$

 $N_x - (CH_2)_y - M_x - Q - (CH_2)_y - H$

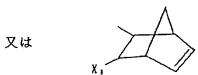
[式中 x_1 = H、アルキル又はCOOH、M=O又は %又はアルキル、x=0又は1、y=0、1、2又は3、 S、Q=-C=C-Xは-CR4 = CH4 -、R4 = H※30 【化8】

$$\begin{array}{c|c} & \text{MX}_1 & -(\text{CH}_2) \, \text{y}_1 \\ & & \text{CH} \\ & \text{CH} \\ & \text{X}_1 & \text{MX}_2 & -(\text{CH}_2) \, \text{y}_2 \end{array}$$

[式中 $X_1 = H$ 、アルキル又はCOOH、M = O又は S, x_1 及び $x_2 = 0$ 又は $1, y_1$ 及び $y_2 = 0, 1,$ $2又は3、その際x₁ + x₂ + y₁ + y₂ <math>\leq 4$ 、y₁ + y2 ≥1に相当する。

【化9】

[式中 X_i =H、アルキル又はCOOH、M=O又は S, $T = (CH_2)_r - M_r - CH = CH - (CH_2)$ y - H, $x = 0 \times 1$, y = 0, 1, 2×3 , z = 1又は2である]。



重縮合生成物が用いられる。すなわち

- 芳香族ジアミノジヒドロキシ化合物及び芳香族ジカル ポン酸又はジカルボン酸クロリドからなる共重縮合生成 40 物、

- 芳香族アミノヒドロキシカルボン酸のホモ重縮合生成

- 芳香族ジアミノジヒドロキシ化合物、芳香族ジカルボ ン酸又はジカルポン酸クロリド及び芳香族アミノヒドロ キシカルポン酸からなる共重縮合生成物。

【0015】有利には以下の形式のヒドロキシポリアミ ドが使用される。

-3.31-ジヒドロキシベンジジン及びイソフタル酸 ジクロリドからなる重縮合生成物、

【0014】ヒドロキシポリアミドには基本物質として 50 -3,3′-ジヒドロキシベンジジン、2,2-ビス

(6)

特開平5-197153

9

 $(3-P \le J-4-E$ ドロキシフェニル)-1, 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン及びイソフタル酸ジクロリドからなる重縮合生成物、

-3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸の重縮合生成物。

【0016】ジアミノジヒドロキシ化合物としては、3,3′ージヒドロキシベンジジン(3,3′ージヒドロキシー4,4′ージアミノピフェニル)の他に,この化合物の異性体も使用可能であり、また他のヒドロキシ基合有芳香族ジアミン例えば3,3′ージヒドロキシー104,4′ージアミノジフェニルエーテルも使用できる。イソフタル酸ジクロリドの他にジカルポン酸としてイソフタル酸も使用することができる。しかしジカルボン酸としてはテレフタル酸ジクロリドを用いることもできる。

【0017】基本物質は更に改質されるアミノ末端基を 有する。すなわちアミノ基は(不飽和脂肪族、脂環式又 は芳香族のカルポン酸の)酸アミド基に変えられる。こ の改質は、アミノ末端基を適切なカルボン酸誘導体、特 にカルボン酸クロリド及び無水ジカルボン酸と反応させ 20 るようにして行う。この場合好適には、ヒドロキシポリ アミドを製造する際にジカルボン酸又はジカルボン酸ク ロリドを過少量で処理し(製造自体に関しては例えば欧 州特許出願公開第0391196号明細書参照のこと) またその際残留する遊離アミド基を更に不飽和カルボン 酸の誘導体と反応させる方法で行う。その際特に酸塩化 物の使用に際して、反応をカルボン酸誘導体がアミノ基 と反応し、(ヒドロキシポリアミドの)ヒドロキシル基 とは反応しないようにして行うことが必要である。更に 次にカルポン酸誘導体を反応溶液に徐々に滴下し、反応 を必要に応じて低温で、すなわち約0℃又はそれ以下の 温度で行う。

【0018】(ヒドロキシポリアミドの)アミノ末端基を改質するのに適した化合物は例えば無水マレイン酸、無水ノルポルネンジカルポン酸及び4-ビニルー安息香酸クロリドである。その際不飽和カルポン酸の誘導体を使用した際の利点は、焼結処理時に付加的な網状化反応が生じることにある。無水マレイン酸及び無水ノルボルネンジカルポン酸のような環状の無水カルボン酸を使用する場合、焼結時に同時に架橋するか又は接着性を改善40することのできる隣接するヒドロキシル基を有するイミドを生じる他の利点がある。

【0019】本発明によるポジ型レジストにおいては光 括性成分としてそれ自体は公知の感光性ジアゾキノン、特にo-キノン及びo-ナフトキノンジアジドを使用する(これに関しては欧州特許第0023662号明細書参照のこと)。有利には6-ジアゾ-5(6)-オキソー1-ナフタリンスルホン酸のエステル又はアミドを、特に β , $\beta-$ ビス(4-ヒドロキシフェニル)-プロパンのビス-ナフトキノン- [1, 2]-ジアジド- 50

10

(2) -5 - スルホン酸エステルを使用する。その際ヒドロキシボリアミドとジアゾキノンとの質量比は有利には1:20~20:1、更に有利には1:10~10:1である。

【0020】耐高熱性レリーフ構造物を製造するには本発明によるポジ型レジストを層又は箔の形で施し、マスクを介して化学線で露光するか又は光線、電子線又はイオン線を導入することにより照射する。引続き露光又は照射された層又は箔部分を溶出又は除去し、その際得られたレリーフ構造物を更に焼結する。

【0021】ホトレジストは有利には有機溶剤中に溶解して基板に施される。その際溶剤としては有利にはN-メチルピロリドンが使用される。しかしその他のジメチルホルムアミド及びN,N-ジメチルアセトアミドのような類似した特性を有する他の有機溶剤、並びに上記溶剤の混合物を使用することもできる。

【0022】レリーフ構造物を製造する場合有利には接着剤及び/又は湿潤剤を使用してもよい。その際接着剤又は湿潤剤をポリマー溶液に添加してもよいが、しかしまた被覆する前にそれらを基板に施してもよい。ポリマー溶液は有利には遠心分離法並びに浸漬又は噴霧法によって基板に施される。しかしその他にブラシ掛け及びローラ掛けのような他の被覆法を用いてもよい。基板は有利にはガラス、金属(特にアルミニウム)、プラスチック又は半導体物質からなる。

【0023】構造化されたポリマー層の耐高熱性ポリペンズオキサゾールへの変換は焼結処理により行われる。その際一般に200~500℃の温度が選択される。有利には300~400℃の温度で焼結する。このようにして良好な膜形成特性を有する誘電性の高原子価のポリペンズオキサゾール、特にヘキサフルオルプロピル部分構造を有するものが得られる。

[0024]

【実施例】本発明を実施例に基づき更に詳述する。

【0025】例1 ヒドロキシポリアミドの製造

2, 2-ピス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)
-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオルプロパン1
05質量部及び3, 3′-ジヒドロキシベンジジン62
質量部をアルゴン下にN, N-ジメチルアセトアミド1
380質量部及びピリジン250質量部に溶解した。更に0℃に冷却したこの溶液に激しく攪拌しながらシクロヘキサノン460質量部に溶かしたイソフタル酸ジクロリド104質量部を滴下した。2.5時間攪拌後反応混合物を室温に温め、更に3.5時間攪拌する。12時間放置後攪拌しながら徐々に無水ノロボルネンジカルボン酸37.1質量部を滴下し、更に12時間室温で放置した。引続き反応溶液を水181に滴下し、更にその際沈潤するポリマーを洗浄及び真空乾燥棚中でNaOHを介して乾燥した。

【0026】例2 ヒドロキシボリアミドの精製

(7)

特開平5-197153

11

例1に基づき製造したヒドロキシポリアミドをイオン交換体により精製した。更に市販の陰イオン交換体150質量部を蒸留水中に懸濁させ、クロマトグラフィーカラムに満たし、中性洗浄した。引続き水をNーメチルピロリドンと交換した。同様に市販の陽イオン交換体100質量部を蒸留水に懸濁させ、クロマトグラフィーカラムに満たし、溶離物が酸性反応を呈するまで10%HC1で洗浄した。引続き水で中性及び塩化物を含まなくなるまで洗浄し、更に水をNーメチルピロリドンと交換した。

【0027】精製のため無水ヒドロキシポリアミド200質量部をN-メチルピロリドン2000質量部に溶解し、更に溶液を陰及び陽イオン交換体に送った。このようにして精製されたポリマー溶液を水約171に滴下し、その際沈酸するポリマーを分離し、洗浄し及び真空乾燥棚中でNaOHを介して乾燥した。

【0029】例3 レジスト溶液の製造 上述のようにして製造しかつ精製したポリベンズオキサ 12

ゾール前駆体 15質量部をN-メチルピロリドン65質 量部に溶かした β , $\beta-$ ピス(4-ヒドロキシフェニル)-プロパンのピスーナフトキノンー $\begin{bmatrix} 1, 2 \end{bmatrix}$ -ジアジドー (2) -5-スルホン酸エステル 3質量部の溶液に加えた。更にその際得られた溶液を 0.8μ mフィルタで圧縮滤過した。

【0030】この種の溶液は溶液の粘性に関しても技術的特性に関しても貯蔵安定性を示す。

【0031】例4 レリーフ構造物の製造

シリコンウエハ上にまず接着助剤を施した(5000回転/分-30秒間;80℃-10分間)。更にこのシリコンウエハを遠心分離法で(3000回転/分-20秒間)例3に基づき製造された光活性溶液で被覆し、次いで乾燥した(層厚1.6μm)。引続き6~7秒間マスクを介して露光し(MJP55:23mW/cm²、OAIで測定して400nm)、MIF現像剤NMD-3(0.32%)で現像し、その後拡散炉中で窒素下に焼結した(焼結プログラム:室温~170℃-1時間、170~300℃-1時間、300~400℃-1時間、20400~室温-4時間)。

【0032】その際1.6μm以下の解像度を有する微細な熱形状安定性のレリーフ構造物が生じた。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/027

21/312

B 8518-4M

(72)発明者 ジークフリート ビルクレ

ドイツ連邦共和国 8552 ヘヒシユタツト フアイト・シユトツス・シユトラーセ

46

(72)発明者 ヘルムート アーネ

ドイツ連邦共和国 8551 レツテンパツハ ハイデシユトラーセ 6